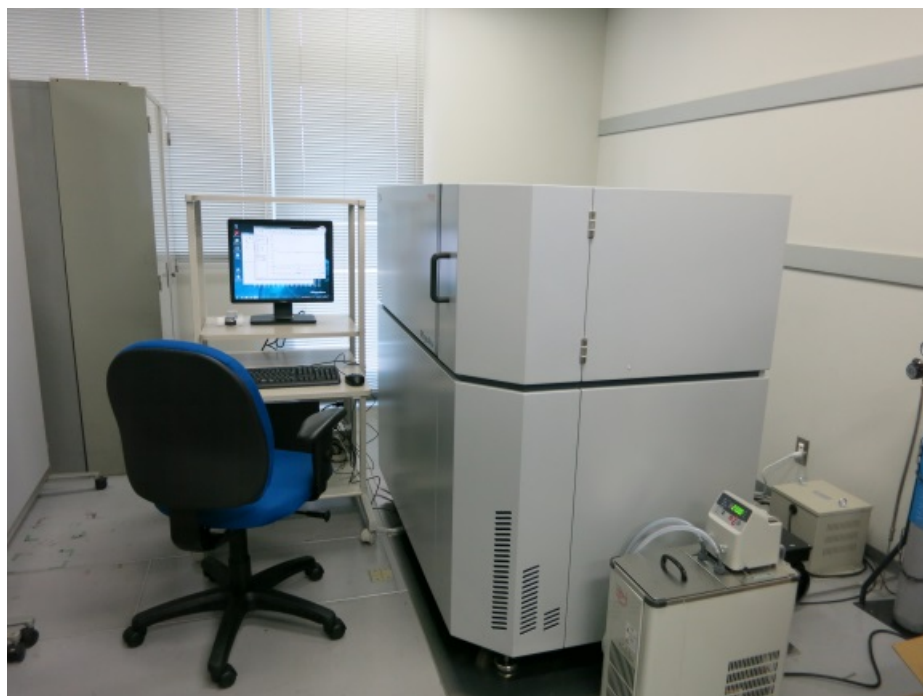


グロー放電発光分析装置



本装置は、グロー放電で試料をスパッタリングし、スパッタされる原子の発光を連続的に分光することにより、試料表面から約50 μ mの深さ程度までの元素分布を測定する装置です。

試料を高真空に保持する必要がなく、簡単に短時間で皮膜の表面から深さ方向(数10 μ m程度)の元素分析ができるという、他の分析機器にない大きな特長を持っています。

本装置は、浸炭・窒化などの表面改質層、多層めっき、複合めっき、表面処理鋼板、ステンレスなどの不動態膜、PVD多層膜、二次電池用電極、太陽電池薄膜などの様々な表面の分析に適用できます。

株式会社リガク製 GDA750

- ・測定可能元素: 45元素 (H, Be, B, C, N, O, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ta, W, Pt, Au, Pb, Bi, La, Nd, Dy)
- ・試料形状(寸法): 原則、平滑試料(最小14mm ϕ ~最大150 \times 150mm程度) * 凹面の測定は不可
- ・依頼試験料金: 13,000円 ・装置使用料金: 1時間 4,600円 (指導料別途要)
- ・問い合わせ先: 齊藤(2724)、足立(2648)